

# АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

## НАНОМЕТРОЛОГИЯ

### 28.03.02 Наноинженерия

#### 6 семестр

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ нанометрологии и современных методов обеспечения единства наноизмерений.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Нанометрология» относится к циклу (разделу) Б1.Б.23.

Для успешного изучения дисциплины «Нанометрология» студенты должны быть знакомы с такими дисциплинами, как «Метрология, стандартизация и технические измерения», «Электроника», «Физика», «Физико-химические основы нанотехнологии». Освоение дисциплины «Нанометрология» требуется для последующего изучения дисциплин «Методы диагностики в нанотехнологиях», «Испытание изделий».

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1. Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и услуг, приёмку и учёт товаров по количеству и качеству:

*знать:*

категорийный аппарат товароведения и методы управления ассортиментом и качеством товаров; ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укрупнённого ассортимента потребительских товаров. Факторы их обеспечивающие; правила и методику приёмки и учёта товаров по количеству и качеству.

*уметь:*

управлять ассортиментом, оценивать, контролировать и управлять качеством товаров, учитывать формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов.

*владеть:*

навыками работы с итоварами разного назначения, а также с нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным требованиям.

### 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение и терминология.

Тема 2. Техническое обеспечение нанометрологии.

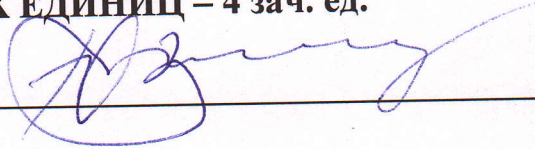
Тема 3. Современные технологии обеспечения единства наноизмерений.

Тема 4. Организационная структура обеспечения единства наноизмерений в РФ.

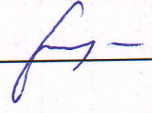
**5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен**

**6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 4 зач. ед.**

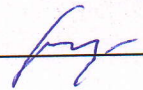
Составитель: доцент Ю.И. Захаров



Заведующий кафедрой «Технология машиностроения» В.В. Морозов



Председатель  
учебно-методической комиссии направления В.В. Морозов



Декан МТФ



А.И. Елкин

Дата: 14.01.2016 г.

